#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-354317

(43)Date of publication of application: 06.12.2002

(51)Int.CL

H04N 5/225 G03B 19/02 H04N 5/335 // H04N101:00

(21)Application number: 2001-161913

(71)Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

**FUJI FILM MICRODEVICES CO LTD** 

(22)Date of filing:

30.05.2001

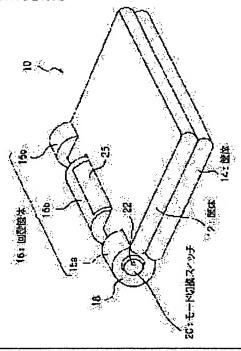
(72)Inventor:

OMORI YASUSHI

# (54) METHOD FOR DETECTING DEFECT IN DIGITAL CAMERA AND PHOTOELECTRIC CONVERSION DEVICE (57)Abstract:

photoelectric conversion device that has improved cosmetic design, while having a simple mechanism, giving safety of the lens, and can also detect defective pixels. SOLUTION: In the digital camera 10, an optical system 200 and an imaging section 54 are arranged at an enclosure 12, a monitor 204 is arranged at the enclosure 14, and for example the free turning of the enclosure 14 to the enclosure 12 or the free turning of both the enclosures 12 and 14 is made by a mechanism which is provided at a turning enclosure 16. Arrangement is made, so that the incidence light surface of an optical system 200, a display means, and a display surface face the same direction in an arrangement, where the enclosures 12 and 14 lie on a straight lire. Sealing state is made at a position where both of them oppose to form a light—shielding state to an image pickup section in a closed state, and this state is used to detect abnormality in the imaging section, and stoppages are made at turning positions where users desire in turning with the other enclosures 12 and 14.

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the defect detection method of a digital camera and a



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-354317 (P2002-354317A)

(43)公開日 平成14年12月6日(2002.12.6)

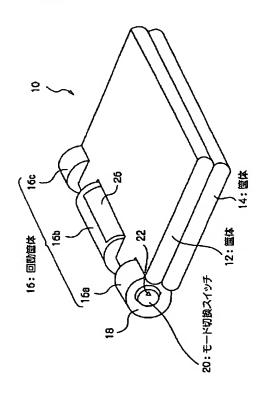
(51) Int.Cl.7	酸別記号 FI デーマコート*(参考)		-マコード(参考)	
H 0 4 N 5/225		H 0 4 N 5/225	Z	2H054
			E	5 C 0 2 2
			F	5 C 0 2 4
G 0 3 B 19/02		G 0 3 B 19/02		
H 0 4 N 5/335		H 0 4 N 5/335	P	
	審査請求	未請求 請求項の数8	OL (全 12 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願2001-161913(P2001-161913)	(71)出願人 0000052	01	
		富士写真	ミフイルム株式会社	
(22)出願日	平成13年5月30日(2001.5.30)	神奈川県南足柄市中沼210番地		
		(71)出願人 391051588		
		富士フィ	(ルムマイクロデバ	イス株式会社
		宮城県県	宮城県黒川郡大和町松坂平1丁目6番地	
		(72)発明者 大森 島	大森康視	
		宮城県黒	即那大和町松坂平	1丁目6番地
		富士フィ	富士フイルムマイクロデバイス株式会社内	
		(74)代理人 1000799	91	
		弁理士	香取 孝雄	
				最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 ディジタルカメラおよび光電変換デパイスの欠陥検出方法

#### (57)【要約】

【課題】 簡便な機構でありながらデザイン性が高く、 かつレンズの安全性を図り、欠陥画素の検出も行えるデ ィジタルカメラおよび光電変換デバイスの欠陥検出方法 の提供。

【解決手段】 ディジタルカメラ10は、筐体12に光学系 200と撮像部54を配設し、筐体14亿モニタ204を配設し、 回動筐体16に設けた機構により、たとえば筐体12に対す る筐体14の自在な回動または両方の筐体12、14の自在な 回動を行わせ、筐体12,14が直線状になる配置で光学系 200の入射光面と表示手段と表示面が同方向を向くよう に配設し、両者の対向位置では密閉状態にすることによ り、密閉状態で撮像部に対して遮光状態を形成し、この 状態を撮像部の異常検出に用い、これ以外の筐体12.14 との回動においてはユーザの所望の回動位置で停止させ ている。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 被写界からの入射光を集光する光学系、 および該入射光をアレイ状に配された受光素子で撮像す る撮像手段を含む第1の筐体と、

1

前記撮像手段で得られた撮像信号に信号処理の施された画像信号を表示する表示手段を含む第2の筐体と、

第1 および第2 の筐体を互いに連結し、第1 および第2 の筐体の内部における電気的な配線を互いに接続する配線を確保し、第1 および第2の筐体の自在な相対的な回動を行わせる回動機構とを含み、

前記回動機構を介して第1 および第2 の筐体は、実質的 に同一平面上にある位置で前記光学系の入射光面と前記 表示手段の表示面とが同方向を向き、前記入射面と前記 表示面との対向する位置で密閉状態とすることを特徴とするディジタルカメラ。

【請求項2】 請求項1に記載のカメラにおいて、該カメラは、

前記撮像手段からの前記撮像信号をディジタル信号に変換する手段と、

該ディジタル信号に基づいて前記受光素子の異常を検出 20 は、 する検出手段と、 前記

該異常の検出された受光素子の位置を記憶する記憶手段 と、

該異常の検出された受光素子の位置に対応した画像データを補正する欠陥補正手段とを含むことを特徴とするディジタルカメラ。

【請求項3】 請求項1または2に記載のカメラにおいて、該カメラは、

前記撮像手段から得られた画像信号の表示をそのままの表示、上下左右の回転表示、および鏡映変換された表示 30 のいずれかを選択する操作手段と、

前記選択に応動して前記撮像信号に対して上下左右の回 転表示用または鏡映変換用の信号処理を施す表示処理手 段とを含むことを特徴とするディジタルカメラ。

【請求項4】 請求項1ないし3のいずれか一項に記載のカメラにおいて、前記回動機構は、電池を収納するととを特徴とするディジタルカメラ。

【請求項5】 請求項1ないし4のいずれか一項に記載のカメラにおいて、前記表示手段は、第2の筐体の該表示手段が配設される側の表面が前記光学系の収納状態で 40の突出量よりも深く凹陥していることを特徴とするディジタルカメラ。

【請求項6】 光電変換デバイスに生じる欠陥を検出する光電変換デバイスの欠陥検出方法であって、該方法は、

前記デバイスへの入射光を遮断する状態に遮光部材を配設し、該デバイスに対する給電を行う第1の工程と、前記遮光状態で所定時間の給電を継続させた後に、前記デバイスのそれぞれから電気信号を読み出す第2の工程と、

読み出した信号レベルとあらかじめ設定した上限関値レベルとを比較して上限関値レベル以上の信号レベルになるデバイスの位置を示す位置情報の記憶を行う第3の工程とを含むことを特徴とする光電変換デバイスの欠陥検出方法。

【請求項7】 光電変換デバイスに生じる欠陥を検出する光電変換デバイスの欠陥検出方法であって、該方法は、

前記デバイスに対して所定の光量以上の入射光を入射させる第1の工程と、

該入射光の入射後、前記デバイスのそれぞれから電気信号を読み出す第2の工程と、

読み出した信号レベルとあらかじめ設定した下限閾値レベルとを比較して下限閾値レベル以下の信号レベルになるデバイスの位置を示す位置情報の記憶を行う第3の工程とを含むことを特徴とする光電変換デバイスの欠陥検出方法。

【請求項8】 光電変換デバイスに生じる欠陥を検出する光電変換デバイスの欠陥検出方法であって、該方法

前記デバイスへの入射光を遮断する状態に遮光部材を配 設し、該デバイスに対する給電を行う第1の工程と、

前記進光状態で所定時間の給電を継続させた後に、前記 デバイスのそれぞれから電気信号を読み出す第2の工程 と、

読み出した信号レベルとあらかじめ設定した第1の閾値 レベルとを比較して第1の閾値レベル以上の信号レベル になるデバイスの位置を示す位置情報の記憶を行う第3 の工程と、

30 前記デバイスに対して所定の光量以上の入射光を入射させる第4の工程と、

該入射光の入射後、前記デバイスのそれぞれから電気信号を読み出す第5の工程と、

第5の工程で読み出した信号レベルとあらかじめ設定した第2の閾値レベルとを比較して第2の閾値レベル以下の信号レベルになるデバイスの位置を示す位置情報の記憶を行う第6の工程とを含むことを特徴とする光電変換デバイスの欠陥検出方法。

【発明の詳細な説明】

0 [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ディジタルカメラ および光電変換デバイスの欠陥検出方法に関し、たとえ ば光電変換する光デバイスがアレイ状に形成されたセン サを用いる画像入力装置等に適用して好適なものであ る。

[0002]

【従来の技術】ディジタルカメラは、ユーザにとって携帯機器の中でファッション性の高い機器である。最近、小型、携帯性、デザインセンスおよびレンズの安全性等50 を考慮されたディジタルカメラが市場に出回っている。

40

3

このようなディジタルカメラはカメラレンズを含む光学 系を使用時だけ筐体から突出させ、使わないときにはカ メラ筐体内に収納し、光学系をカバーする保護機構を具 備している。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】ディジタルカメラにおいてメーカとしては、少しでも無駄なく低コストで良質な商品化を望んでいる。この商品化の観点で見ると、ユーザに受け入れ易いデザイン性および光学レンズの保護・安全性等を重視するあまり、ディジタルカメラには、コストアップさせてしまうような複雑な機構を取り付けていることになる。これからわかるようにメーカの要望とユーザの要望は相反する関係にある。

【0004】一方、ディジタルカメラの撮像部に用いる 固体撮像素子には少ないながら画素欠陥がある。ディジ タルカメラは、現在、製造工程の中で画素の欠陥箇所を 検出し、検出した欠陥画素のデータがカメラに搭載され て出荷されている。したがって、ディジタルカメラは、 ユーザが撮影しても搭載したデータに基づいて撮像画像 が含む欠陥を補正することによって欠陥のない画像を生 20 成している。

【0005】ところで、固体撮像素子は放射線の影響によって新たなキズを生じることがある。しかしながら、カメラは出荷後のため新たなキズに対するデータを得ることができない。また、ユーザやサービスステーションのそれぞれには、製造工場にて固体撮像素子(受光素子)のキズデータの取込みに使用するような治具を設けることもできないし、ディジタルカメラを組み立ててしまっていることから欠陥データの取得は難しい。このため、ディジタルカメラは、一般的に、経年変化で生じた30欠陥に対する欠陥補正を撮影した画像には行わない。

【0006】本発明はこのような従来技術の欠点を解消し、簡便な機構でありながらデザイン性が高く、かつレンズの安全性を図り、欠陥画素の検出も行うことのできるディジタルカメラを提供することを目的とする。 【0007】

【課題を解決するための手段】本発明によるディジタルカメラは上述の課題を解決するために、被写界からの入射光を集光する光学系、およびこの入射光をアレイ状に配された受光素子で撮像する撮像手段を含む第1の筐体と、撮像手段で得られた撮像信号に信号処理の施された画像信号を表示する表示手段を含む第2の筐体と、第1 および第2の筐体を互いに連結し、第1 および第2の筐体の内部における電気的な配線を互いに接続する配線を確保し、第1 および第2の筐体の自在な相対的な回動を行わせる回動機構とを含み、回動機構を介して第1 および第2の筐体は、実質的に同一平面上にある位置で光学系の入射光面と表示手段の表示面とが同方向を向き、入射面と前記表示面との対向する位置で密閉状態とすることを特徴とする。

4

【0008】本発明のディジタルカメラは、第1の筐体に光学系および撮像手段を配設し、第2の筐体に表示手段を配設し、回動機構により第1および第2の筐体を互いに連結し、第1および第2の筐体の内部における電気的な配線を互いに接続する配線を確保し、第1および第2の筐体の自在な相対的な回動を行わせ、実質的に同一平面上にある位置で光学系の入射光面と表示手段の表示面とを同方向に、そして、両者の対向位置では密閉状態とすることにより、密閉状態で撮像手段に対して遮光状態を形成し、この状態を撮像手段の異常検出に用い、これ以外の第1と第2の筐体との回動においてはユーザの所望の回動位置で停止させる。

【0009】また、本発明の光電変換デバイスの欠陥検出方法は上述の課題を解決するために、光電変換デバイスに生じる欠陥を検出する光電変換デバイスの欠陥検出方法であって、この方法は、デバイスへの入射光を遮断する状態に遮光部材を配設し、このデバイスに対する給電を行う第1の工程と、遮光状態で第1の所定時間の給電を継続させた後に、デバイスのそれぞれから電気信号を読み出す第2の工程と、読み出した信号レベルとあらかじめ設定した上限閾値レベルとを比較して上限閾値レベル以上の信号レベルになるデバイスの位置を示す位置情報の記憶を行う第3の工程とを含むことを特徴とする。

【0010】本発明の光電変換デバイスの欠陥検出方法は、遮光部材でデバイスを遮光状態にし、とのデバイスに対して給電し、遮光状態で第1の所定時間の給電を継続させた後に、デバイスのそれぞれから電気信号を読み出して、読み出した信号レベルと上限閾値レベルとを比較して上限閾値レベル以上の信号レベルになるデバイスの位置を示す位置情報の記憶を行うことにより、出荷後であっても製造工場の治具を用いることなく、所望のときにデバイスの、いわゆる白キズに対する欠陥位置の検出を行うことができる。

【0011】さらに、本発明による光電変換デバイスの 欠陥検出方法は上述の課題を解決するために、光電変換 デバイスに生じる欠陥を検出する光電変換デバイスの欠 陥検出方法であって、この方法は、デバイスに対して所 定の光量以上の入射光を入射させる第1の工程と、この 入射光の入射後、デバイスのそれぞれから電気信号を読 み出す第2の工程と、読み出した信号レベルとあらかじ め設定した下限閾値レベルとを比較して下限閾値レベル 以下の信号レベルになるデバイスの位置を示す位置情報 の記憶を行う第3の工程とを含むことを特徴とする。

【0012】本発明の光電変換デバイスの欠陥検出方法は、デバイスに対して所定の光量以上の入射光を入射させ、この入射光の入射後、デバイスのそれぞれから電気信号を読み出し、読み出した信号レベルと下限閾値レベルとを比較して下限閾値レベル以下の信号レベルになる50 デバイスの位置を示す位置情報の記憶を行うことにより

出荷後であっても製造工場の治具を用いることなく、所 望のときにデバイスの、いわゆる黒キズに対する欠陥位 置の検出を行うことができる。

【0013】最後に、本発明による光電変換デバイスの 欠陥検出方法は上述の課題を解決するために、光電変換 デバイスに生じる欠陥を検出する光電変換デバイスの欠 陥検出方法であって、との方法は、デバイスへの入射光 を遮断する状態に遮光部材を配設し、とのデバイスに対 する給電を行う第1の工程と、遮光状態で所定時間の給 電を継続させた後に、デバイスのそれぞれから電気信号 10 を読み出す第2の工程と、読み出した信号レベルとあら かじめ設定した第1の閾値レベルとを比較して第1の閾 値レベル以上の信号レベルになるデバイスの位置を示す 位置情報の記憶を行う第3の工程と、デバイスに対して 所定の光量以上の入射光を入射させる第4の工程と、と の入射光の入射後、デバイスのそれぞれから電気信号を 読み出す第5の工程と、第5の工程で読み出した信号レ ベルとあらかじめ設定した第2の閾値レベルとを比較し て第2の閾値レベル以下の信号レベルになるデバイスの 位置を示す位置情報の記憶を行う第6の工程とを含むと 20 とを特徴とする。

【0014】本発明の光電変換デバイスの欠陥検出方法 は、遮光部材でデバイスを遮光状態にし、このデバイス に対して給電し、遮光状態で第1の所定時間の給電を継 続させた後に、デバイスのそれぞれから電気信号を読み 出して、読み出した信号レベルと上限閾値レベルとを比 較して上限閾値レベル以上の信号レベルになるデバイス の位置を示す位置情報の記憶を行って、所望のときにデ バイスの、いわゆる白キズに対する欠陥位置の検出を行 い、デバイスに対して所定の光量以上の入射光を入射さ せ、この入射光の入射後、デバイスのそれぞれから電気 信号を読み出し、読み出した信号レベルと下限閾値レベ ルとを比較して下限閾値レベル以下の信号レベルになる デバイスの位置を示す位置情報の記憶を行って、製造工 場の治具を用いることなく、所望のときにデバイスの、 いわゆる黒キズに対する欠陥位置を検出することができ

### [0015]

【発明の実施の形態】次に添付図面を参照して本発明に よるディジタルカメラの一実施例を詳細に説明する。 【0016】本実施例は、本発明を適用したディジタル カメラ10について説明する。本発明と直接関係のない部 分について図示および説明を省略する。

【0017】ディジタルカメラ10の機構について最初に 説明する。ディジタルカメラ10は、図1に示すように、 ほぼ同じ大きさの筐体12,14が一体的に回動筐体16を介 して枢設されている。回動筐体16は、回動筐体16a, 16 b, 16cと3つの部分に分かれている。回動筐体16aに は、この筐体16aの側面18の中心位置にモード切換スイ ッチ20が配設されている。モード切換スイッチ20には、

たとえば選択するモード位置を示すマーク22が形成され ている。側面18のモード切換スイッチ20の周囲には、た とえばモードマーク20a~20hが印刷されている(図2を 参照)。

6

【0018】モードマークとしては、それぞれ、各種の 条件・項目等を選択して設定するSETUP 20a、セルフタ イマ20b、オート撮影モード20c、撮影した画像の再生モ ード20d、鏡像表示を含む画像表示変換するミラーモー ド20e、画素欠陥検出するクリーニングモード20f、画像 データの破棄を示すデータ消去モード20gおよびパスワ ード設定モード20hがある。図2はクリーニングモード が選択されていることを示している。ディジタルカメラ 10は、たとえば電源投入後に、モードマーク20a~20hの 一つが所定時間以上に指し示されている場合、この指し 示されたモードが選択されたものとし、後述する操作部 30から選択したモードを示す操作信号300をシステム制 御部34に出力する。

【0019】回動筐体16aには、筐体12,14を回動停止 位置で保持する回動保持機構を備えた回動軸160, 162が 筐体12,14の回動を妨げない位置に貫設されている。本 実施例の回動筐体16aでは、回動軸160亿対する回動保持 機構を配設している。回動保持機構は、たとえば回動筐 体16a内でコイルバネ(図示せず)の側面18内側の一端1 64にて固定させ、側面18内側の対向面とコイルバネの間 に座金(図示せず)を入れて回動筐体16aとの磨耗を防 止し、回動軸160に沿って直線状にしたコイルバネを軸 として、筐体12の挿通口120, 122を通し、さらに、回動 筺体166の側面24に設けた挿通□166を通す。挿通□166 を通したコイルバネは、コイルバネの他端が固定され る。ととで、回動筐体16aにおける筐体12,14側の挿通 口は図示しない。とのようにコイルバネの両端を固定さ せ、筐体12を回動させることにより、コイルバネを圧縮 させ筐体12, 14を回動筐体16a, 16bで挟み込んで押さえ て所望の回動停止位置に保持させている。

【0020】一方、筐体14と一体的に回動させるため に、たとえば回動筐体16a内の側面18側と回動筐体16b内 の側面24には、それぞれ回動軸162の軸受け168, 170が 設けられている。筐体14には、回動軸162が筐体14の挿 通□124, 172を通して軸受け168, 170で保持されてい る。これにより筐体14は回動中心の周りを回動する。

【0021】回動筐体16bには、電池(図示せず)を収 納可能にする空間が形成され、電池の電極が形成されて いる(図示せず)。回動筐体16bには電池の脱落防止用 の蓋26が配設されている。このようにして回動筐体16b は電池収納ボックスの役割も担っている。回動筐体16b は、電池の各電極からの電源ラインを筐体12または筐体 14を介して回動筐体16aに引き回し、筐体12および筐体1 4にそれぞれ供給する。また引き回し先は回動筐体16aに 限定されず、回動筐体16cでもよい。

50 【0022】回動筐体16cは、回動筐体16aの回動保持機

構と逆の構成にしている。すなわち、図示しないが回動 軸160を、上述した筐体14の回動保持機構とし、回動軸1 62にコイルバネを用いた回動保持機構にする。これによ り、筐体12,14にそれぞれ配設されているデバイスや回 路等に対して電気信号を供給する、たとえば束ねたフラ ットケーブルを筐体12と筐体14との間で引き回す空間を 確保することができる。

【0023】図1に戻って、ディジタルカメラ10は、回 動筐体16によって一体化された筐体12と筐体14とを閉じ た状態を示している。この閉じた状態は筐体12と筐体14 10 との間から光が漏れ込まないように遮光されている。と の場合、筐体14が遮光部材の役割を担っている。この状 態を保つために、筐体12と筐体14に簡単な閉状態ロック 機構を設けるとよい。また、この状態で、電源を投入す る場合を考慮して電源スイッチを筐体12または筐体14の 側面に設けてもよい(図示せず)。このように電源スイ ッチを配設すると、たとえばクリーニングモードのよう に遮光状態を保ったまま、動作させる場合に有利であ る。筐体12、14が閉じられた筐体の外側表面には何も配 設されていない。後述する光学系やフラッシュは、複雑 20 な保護機構を設けることなく、単に蓋をするようにカメ ラ10を閉じることで保護されている。

【0024】上述したロック機構を解除して、筐体12と 筐体14を開いた状態を図4に示す。本実施例において筐 体12, 14を閉じた際の隠れる表面を内面12a, 14aの側と する。筐体内面12aには、光学系200とフラッシュ(閃光 発光部) 202とが設けられている。また、筐体内面14aに は、モニタ204と項目選択操作部206とが設けられてい る。光学系200およびフラッシュ202は、筐体12,14が開 いて収納状態にある場合、図示しないが光学系200にお ける最小限の高さdの突出部分をより低くなるように前 提に設計する。モニタ204は、筐体内面14aよりもたとえ ば深さDで示すようにモニタ表面204を、凹陥させて奥ま った位置に配設する(D> d)。

【0025】ディジタルカメラ10は、筐体12、14を閉じ ても、深さDが突起部分の高さdよりも深くすることで光 学系200がモニタ204と衝突して破壊される虞を回避して いる。モニタ204をこのような位置に配設することによ り、モニタ表示する際にも周囲の明るさの影響も抑えて 画像を鮮明に表示させることができるので、視認性のよ 40 いモニタ204を提供することができる。この窪み量は数 ミリ程度でよい。

【0026】また、項目選択操作部206には、各項目に カーソルを移動させるカーソル指示スイッチである十字 キー206a、カスタムボタン206b、表示ボタン206c、メニ ュー/実行ボタン206dおよびレリーズシャッタボタン20 6eが備えられている。

【0027】本実施例のディジタルカメラ10は、図4の 開いた状態から、さらに各筐体12,14を90。 開く方向に

させる。換言すると、図4の状態からたとえば、筐体12 をそのままに筐体14をさらに180°回動させ、図5に示 す筐体12,14の外筐が当接状態になる。回動筐体16を下 側にしてユーザが保持すると、ディジタルカメラの各構 成要素の配置は、通常使用するディジタルカメラと光学 系200およびフラッシュ202の配置が同じになる(図5を 参照)。そして、この配置でカメラ10は、撮像モードを 選択すると、撮像可能な状態になり、モニタ204に撮像 した画像をムービー表示させる。

【0028】また、前述した回動保持機構を用いている ことから、図6の位置で筐体12を所望の回動位置保持す ることができる。このような位置で撮像すると、自分自 身の撮影や自分を含めた友人との写真撮影等も行うこと が可能になる。ディジタルカメラ10は、撮像した画像に 対して後述する上下/左右の回転、または表示系の変更 (鏡映変換)を信号処理により行うことができる。特 に、ユーザは自分自身を撮影した場合、ミラーモードで 表示画像を鏡に写った感覚で使用することができる。こ の動作は、モード切換スイッチ20をミラーモード20eに 合わせて項目選択操作部206の十字キー206aの選択に応 動して画像の表示変更を指示している。

【0029】さらに、この回動自在なカメラ10は、図7 に示す位置で撮影することもできる。これは、たとえ ば、被写体とカメラの間が混雑していて視界が奪われ、 被写体の視認が困難な場合でも、視野の遮蔽を回避して 斜め上方から矢印Aの方向へのハイアングル撮影を可能 にし、モニタ204で矢印Bの方向から被写界を確認しなが ら撮影することができる。筐体12には、側面12bに記録 媒体を挿入する挿入扉208が配されている。

30 【0030】なお、ディジタルカメラ10は、閉じた状態 から通常上下方向に開く状態を説明したが、本実施例に 限定されず、図示しないが通常の開く状態を左右に開 く、いわゆる観音開きするように構成し、動作させても

【0031】次にディジタルカメラ10の電気的な回路構 成について説明する(図8を参照)。また、本発明と直 接関係のない部分について図示および説明を省略する。 **ととで、信号の参照符号はその現れる接続線の参照番号** 

【0032】ディジタルカメラ10には、光学系200、操 作部30、システムバス32、システム制御部34、ドライバ 36、信号発生部38、メモリ40、タイミング信号発生部4 2、前処理部44、信号処理部46、圧縮/伸長部48、スト レージ部50、絞り機構52、撮像部54、フラッシュ202お よびモニタ204が含まれている。

【0033】とれら各部を順次説明する。光学系200 は、たとえば、複数枚の光学レンズを組み合わせて構成 されている。光学系200℃は、図示しないが、これら光 学レンズの配置する位置を調節して画面の画角を操作部 回動させて、内面12aと内面14aとを互いに逆向きに配置 50 30からの操作信号300に応じて調節するズーム機構や被

写体とカメラ10との距離に応じてピント調節する、AF (Automatic Focus : 自動焦点)調節機構が含まれてい る。操作信号300は、システムバス32を介してシステム 制御部34に供給される。光学系200には、後述するドラ イバ36からこれらの機構を動作させる駆動信号36a が供 給されている。

9

【0034】操作部30には、図4に示したモード切換ス イッチ20および項目選択操作部206が備えられている。 項目選択操作部206は、たとえば、レリーズシャッタス イッチ206eやたとえばモニタ画面に表示される項目にカ ーソルを移動させ選択する十字キー206a等からの操作信 号300をシステムパス32を介してシステム制御部34に出 力する。ユーザはモード切換スイッチ20を回動させてモ ードを選択する。また、レリーズシャッタスイッチ206e は、複数の段階のそれぞれで、予備撮像のモードと本撮 像のモードのいずれかを選択する押圧操作を行うことが できる。操作部30は、カメラ10にどのような操作を行う かを示す操作信号(または操作情報)300を出力し、操 作信号はシステムバス32を介してシステム制御部34公報 知される。

【 0 0 3 5 】システム制御部34は、たとえば CPU (Cent ral Processing Unit :中央処理装置)を有する。シス テム制御部34には、図示しないがディジタルスチルカメ ラ10の動作手順が書き込まれたROM (Read Only Memor y: 読み出し専用メモリ)がある。システム制御部34は、 たとえば、ユーザの操作に伴って操作部30から供給され る情報300ととのROMの情報(図示せず)を用いて各部の 動作を制御する制御信号34aを生成する。

【0036】また、システム制御部34には、本発明の特 徴である画素欠陥検出機能部340、欠陥アドレス指示機 能部342および欠陥補正機能部344が備えられている。と の欠陥検出は、新たに設けたクリーニングモードで行わ れる。画素欠陥検出機能部340は、たとえばあらかじ め、後述する撮像部54を遮光状態にして、撮像部54に生 じる、いわゆる白キズおよび黒キズを欠陥として検出す る機能を有している。との機能を発揮するため、画素欠 陥検出機能部340亿は、いわゆる白キズおよび黒キズを 判別する基準レベルに相当する2つの閾値が設定されて いる。遮光時に白キズおよび黒キズの環境下で得られた それぞれの画素データと2つの閾値とを直截に比較して 画素欠陥の有無を判別している。判別する方法について は後段でさらに説明する。画素欠陥検出機能部340は、 画素欠陥が有ると判別された画素の位置を示すアドレス データまたは欠陥検出信号346を欠陥アドレス指示機能 部342に供給する。

【0037】欠陥アドレス指示機能部342は、供給され るアドレスデータまたは欠陥検出信号346を格納するメ モリ機能と、本撮像にともなって供給される画像データ の欠陥位置を検出する欠陥位置検出機能とを有してい る。欠陥位置検出機能は、たとえば、本撮像時に画像デ

ータの供給開始に同期してカウントを開始して格納され ているアドレスデータと一致した際に欠陥補正機能部34 4に対して欠陥補正指示信号348を出力する。欠陥アドレ ス指示機能部342には、カウントを行うために信号発生 部38からメモリ40にも供給する同じカウントクロック信 号302が入力されている。

【0038】また、クリーニングモード時に画像データ の供給開始に同期してカウントを開始して欠陥検出信号 346が供給された際に欠陥検出信号346をカウント記憶の イネーブル信号として用いて内蔵するメモリにこのカウ ント値を記憶するようにしてもよい。

【0039】欠陥補正機能部344は、上述したように本 撮像時に欠陥アドレス指示機能部342からの欠陥補正指 示信号348を受けて、欠陥補正機能部344に供給される画 像データ310のうち、欠陥アドレスに該当する画素デー タに対する相関性の高い画素データ、または周囲の画素 データの平均値等の生成を行い、これら生成した画素デ ータのいずれかで欠陥画素データを置換する。該当画素 データの置換に用いる欠陥補正データは、欠陥補正機能 部344が有する各種の演算処理機能により該当画素の周 20 囲に位置する画素データを用いて生成される。これらの 演算処理機能の中に上述した相関性の有無の判別処理や データの平均化処理等が含まれている。欠陥補正機能部 344は、欠陥画素データに対してこのようにして生成し た欠陥補正データを出力してメモリ40における該当画素 データとの置換を行っている。

【0040】システム制御部34は、生成した制御信号34 aをドライバ36、信号発生部38、あらわに制御信号34aの 供給を示していないタイミング信号発生部42、前処理部 44の他に、システムバス32を介して信号処理部46、圧縮 /伸長部48、ストレージ部50およびモニタ204にも供給 している。

【0041】信号発生部38は、システム制御部34からの 制御に応じてシステムクロック302を発振器(図示せ ず) により発生する。信号発生部38は、このシステムク ロック302をタイミング信号発生部42および信号処理部4 6亿供給する。また、システムクロック302は、たとえ ば、システムバス32を介してシステム制御部34の動作タ イミングとしても供給される。

【0042】タイミング信号発生部42は、供給されるシ ステムクロック302を制御信号34aに基づいて各部を動作 させる各種タイミング信号420を生成する回路を含む。 タイミング信号発生部42は、生成したタイミング信号42 0をドライバ36に供給する。ドライバ36は、前述した光 学系200のズーム調節機構およびAF調節機構の他、絞り 調節機構52、撮像部54およびフラッシュ202にも駆動信 号36aをそれぞれに合わせて供給する。

【0043】絞り調節機構52は、被写体の撮影において 最適な入射光の光束を撮像部54に供給するように入射光 東断面積(すなわち、絞り開口面積)を調節する機構で

40

ある。絞り調節機構52にもドライバ36から駆動信号36a が供給される。この駆動信号36aは、前述したシステム 制御部34からの制御に応じて行う動作のための信号であ る。との場合、システム制御部34は、図示しないが、撮 像部54で光電変換した信号電荷を基にAE(Automatic Ex posure:自動露出)処理として絞り・露光時間を露光パ ラメータとして算出している。この算出した値に対応す る制御信号34aがタイミング信号発生部42に供給された 後、絞り調節機構52には、このタイミング信号発生部42 からの信号420に応じた駆動信号36aがドライバ36から供 給される。なお、露光パラメータは、システム制御部34 でなく、信号処理部46で算出させるようにしてもよい。 【0044】撮像部54には、光学ローパスフィルタ54 a、色フィルタ54bおよび撮像素子54cが含まれている。 撮像素子54cは、光電変換する受光素子がアレイ状に配 列され、光学系200の光軸と直交する平面(撮像面)が 形成されるように配置されている。また、撮像素子の入 射光側には、個々の撮像素子に対応して光学像の空間周 波数をナイキスト周波数以下に制限する光学ローパスフ ィルタ54aと一体的に色分解する色フィルタ54bが一体的

【0045】撮像素子54cには、 CCD (Charge Coupled Device:電荷結合素子) や MOS (Metal Oxide Semicondu ctor:金属酸化膜半導体)タイプの固体撮像デバイスが 適用される。撮像部54では、供給される駆動信号36aに 応じて光電変換によって得られた信号電荷を所定のタイ ミングとして、たとえば、信号読出し期間の電子シャッ タのオフの期間にフィールドシフトにより垂直転送路に 読み出され、との垂直転送路をラインシフトした信号電 荷が水平転送路に供給され、この水平転送路を経た信号 電荷が図示しない出力回路による電荷/電圧変換によっ てアナログ電圧信号304にされ、前処理部44に出力され る。撮像部54は、CCDタイプでは信号電荷の読出しモー ドに応じて画素間引き読出しや全画素読出しが行われ

に配設されている。本実施例では単板方式の色フィルタ

を用いて撮像する。

【0046】前処理部44には、図示しないがCDS (Corre lated Double Sampling:相関二重サンプリング;以下CD S という) 部およびA/D 変換部が備えられている。CDS 部は、たとえば、CCD型の撮像素子を用いて、基本的に その素子により生じる各種のノイズをタイミング信号発 生部42からのタイミング信号420によりクランプするク ランプ回路と、タイミング信号420亿より信号304をホー ルドするサンプルホールド回路を有する。CDS部は、ノ イズ成分を除去してアナログ出力信号をA/D変換部に送 る。A/D変換部は、供給されるアナログ信号の信号レベ ルを所定の量子化レベルにより量子化してディジタル信 号に変換するA/D変換器を有する。A/D変換部は、タイミ ング信号発生部42から供給される変換クロック等のタイ ミング信号420により変換したディジタル信号306をシス 50 12

テムバス32を介してメモリ40に出力する。

【0047】メモリ40は、非破壊型のメモリで、撮像し た一画面の画素データを格納するフレームメモリであ る。メモリ40には、システム制御部34から制御信号34a がシステムパス 32に送られて、システムバス 32、信号線 308を介して供給される画素データ306が書き込まれる。 メモリ40は、格納している画素データを各部にシステム バス32を介して読み出す。メモリ40は、システムバス32 を介してシステム制御部34、信号処理部46やストレージ 部50と画素データのやり取りを行っている。メモリ40の 書込み/読出し制御はシステム制御部34によって行われ

【0048】メモリ40には、本撮像モードでは欠陥該当 の画素データに対して欠陥補正した画素データ310が欠 陥補正機能部344から供給され、この供給された画素デ ータ310を格納することで置換が行われる。この欠陥補 正完了後、メモリ40は、信号線308、システムバス32、 信号線312を介して欠陥補正された画素データを信号処 理部46公出力する。

【0049】信号処理部46には、データ補正部460、色 差マトリクス部462および方向転換処理部464が含まれ る。データ補正部460には、図示しないが色の補正を行 うガンマ補正回路や自動的にホワイトバランスの調整を 行うAWB (Automatic White Balance) 回路等がある。特 に、ガンマ補正回路には、ROM (Read Only Memory)に供 給されるディジタル信号とこのディジタル信号に対応し て出力する補正データとを組にした複数のデータセット の集まりであるルックアップテーブルを用いる。これら 一連のデータ補正においてもタイミング信号発生部42か らのタイミング信号420に応じて供給される。データ補 正部460は、この処理した補正データ314を色差マトリク ス部462に出力する。

【0050】色差マトリクス部462は、データ補正部460 から供給される画素データ314を用いて画素データがそ れぞれ対応して有する原色RGBから輝度データおよび2 つの色差データを生成する機能がある。色差マトリクス 部462は、生成した輝度および色差データ316を方向転換 処理部464に供給する。

【0051】方向転換処理部464は、供給された輝度お よび色差データ316に対し、モニタ204への表示方向およ びミラーモードの条件に応じて信号処理を施す機能を有 している。方向転換処理部464には、これらの条件に応 じた制御信号34aがシステム制御部34から供給されてい る。方向転換処理部464は、表示方向の指示において項 目選択操作部206の十字キー206aにより、たとえば画像 の上側を通常表示するモニタ204の位置に設定し、上側 の選択または何も選択しない場合、そのまま表示させ る。これ以外の左右下を示す3方向のいずれかが選択さ れた場合、選択された方向に画像を回転させる。

【0052】また、方向転換処理部464は、モードがモ

値およびそのための露光時間(露光パラメータ)を設定 し、不足分を補う光量を算出し、閃光発光を含めて適正 な露光パラメータに調整し、制御信号34aを生成してい

14

ード切換スイッチ20亿よってミラーモード20eが選択さ れている場合、表示をたとえば右手系から左手系に鏡像 変換を行う。鏡像変換とは、図示しないが対象の画像を 裏側から見た画像のように入れ換える処理を行う。この 変換により、モニタ204に鏡に映したように表示させる ことができる。信号処理部46は、モニタ204に画像信号 を供給する場合D/A変換を経たアナログ信号にして供給 している。

【0057】とのようにして撮像部54に含まれる欠陥画 素を出荷後でも治具を用いることなく、光学系200を遮 光して各種のキズの有無を検出することができる。

【0053】なお、図1では便宜上ディジタル信号とア ナログ信号との区別なく、信号処理部46は出力信号318 として出力させている。また、信号処理部46において、 具体的な説明を省略するが、操作部30のレリーズシャッ タボタン206eが半押し状態と、レリーズシャッタボタン 206eが全押し状態とに応動してそれぞれ、動作させてい ることは言うまでもない。

【0058】次にディジタルカメラ10におけるクリーニ ングモードの手順に着目して説明する。クリーニングモ ードでディジタルカメラ10は、図9に示すフローチャー トに応じて動作する。ステップS10亿て光学系200を遮光 状態にしたままで電源投入後、各種の初期設定処理が行 われる。以後、指定したモードでの動作設定や動作実行 を行う。とのモードの確認を行う中で、本実施例の特徴 であるクリーニングモードが選択されているかどうかの 判断を行う (ステップS12)。図2に示すように、クリー ニングモードに切り換えられている場合(YES)、ステッ プS14に進む。モード切換スイッチ20がこのモードを示 していなかった場合(NO)、これ以外のモードが選択さ

【0054】圧縮/伸長部48は、たとえば、直交変換を 用いたJPEG (Joint Photographic image coding Expert s Group) 規格での圧縮を施す回路と、この圧縮した画 像を再び元のデータに伸長する回路とを有する。圧縮/ 伸長部48は、システム制御部34の制御により記録時には 20 れていると判断して他の動作処理に移行する。 圧縮したデータを信号線320、システムバス32および信 号線322を介してストレージ部50に供給する。圧縮/伸 長部48が伸長処理を行う場合、逆にストレージ部50から 読み出したデータ322をシステムバス32および信号線320 を介して圧縮/伸長部48に取り込んで処理する。とと で、処理されたデータも信号処理部46を介してモニタ20 4に供給して表示させる。

【0059】クリーニングモードの確認後、キズの検出 処理を行う。キズには白キズと黒キズがあり、いずれの キズから検出作業を行ってもよい。最初、ディジタルカ メラ10が動作停止状態であったことを鑑みて、本実施例 では白キズ検出から行うことにする。まず、モニタ204 のバックライトの点灯動作をオフにして、撮像素子54c に給電し、所定の待機時間を消灯のまま経過させる(ス テップS14)。

【0055】ストレージ部50は、記録媒体に記録する記 録処理部と、記録媒体から記録した画像データを読み出 は、たとえば、いわゆる、スマートメディア(登録商 標)のような半導体メモリ等の場合、記録処理部と再生 処理部は同じ部分になる。また、記録媒体に磁気ディス ク、光ディスク等を用いる場合、画像データを変調する 変調部とともに、この画像データを書き込むヘッドがあ る。モニタ204は、たとえばバックライト付き液晶表示 装置を用いている。モニタ204はシステム制御部34の制 御に応じて信号線324、システムバス32、信号線326を介 して供給される画像信号を画面の大きさを考慮するとと もに、タイミング調整して表示する機能を有する。輝度 40 データおよび色差データまたは三原色RGB のデータが供 給されるような場合、モニタ204がD/A変換機能を持つと とは言うまでもない。

[0060]次に撮像部54の各画素に欠陥があるかの検 す再生処理部とを含む(ともに図示せず)。記録媒体に 30 出を行う(ステップS16)。時間経過後に、撮像部54は撮 像素子54cから読み出した信号電荷をQA変換によってア ナログ信号にして、このアナログ信号をディジタル信号 の画素データ306にしてシステムバス32、信号線310を介 して画素欠陥検出機能部340に供給される。画素データ3 06はメモリ40に供給して格納してもよい。画素欠陥検出 機能部340では、画素データ306が白キズ基準値以上のと き画素欠陥と判断する。とのとき、アドレスデータまた は欠陥検出のイネーブル信号346として欠陥アドレス指 示機能部342に供給する。との判断に該当しないとき正 常とみなして、何も記憶しない。

【0056】フラッシュ202は、ドライバ36から供給さ れる駆動信号36aに応じて閃光発光する閃光発光部を有 している。フラッシュ202を駆動するドライバ36は、シ ステム制御部34から供給される制御信号34aに応動して 駆動信号36aを生成している。システム制御部34は、た とえば予備の撮像にて行われた測光光量と適正露光光量 との検討に際して被写体までの距離を考慮しながら絞り

【0061】欠陥アドレス指示機能部342では、供給さ れるアドレスデータをそのまま記憶する(ステップS1 8)。また、イネーブル信号として供給された場合、供給 時の内蔵する同期カウンタのカウント値を記憶する。 【0062】次に、黒キズの検出処理に進む。この処理 では、モニタ204のパックライトをオンにして点灯さ せ、撮像素子54cに給電して露光する(ステップS20)。 との場合も点灯後、所定の待機時間を経過させて黒キズ の検出を行う。黒キズ検出に用いる光源はバックライト 50 に限定するものでなく、フラッシュ202を瞬間的に強制

30

発光させてもよい。

【0063】撮像部54から前述したと同じ手順を介してディジタル信号の画素データ306を取り出す。黒キズは、十分な光量を供給しているにもかかわらず、画素データ306が黒キズ基準値以下の画素データ値のとき画素欠陥とみなし黒キズという(ステップ522)。そして、黒キズと判断した画素のアドレスデータまたは欠陥検出のイネーブル信号346を欠陥アドレス指示機能部342に供給する。

【0064】欠陥アドレス指示機能部342では、白キズの場合と同様にアドレスデータまたは欠陥検出信号346が供給されたときアドレスデータまたはカウント値を内蔵するメモリに記憶する(ステップ524)。 ここで用いる内蔵メモリは、これに限定されず、外部に別途欠陥アドレス用メモリを配設するようにしてもよい。この記憶処理の終了後、モニタ204のバックライトを消灯させる(ステップ526)。最後に、電源を自動的にオフさせて(ステップ528)、クリーニングモードを終了する。

【0065】とのように動作させることにより、製造工程で行っていたと同じ処理を出荷後でも筐体12,14を閉 20 じた状態で治具なしに欠陥検出を行うことができる。これにより、ディジタルカメラ10は、検出した欠陥の位置に対して欠陥補正を施して画素欠陥にともなう画質劣化を発生させることなく、ユーザに写真を提供することができる。

【0066】以上のように構成することにより、光学系の保護用に複雑なメカニカル機構を採用しなくても光学系を十分保護し、所望の回動位置から被写体をモニタで確かめながら狙うこともできる。この保護に用いる機構の簡略化により、製造コストを抑えることができる。デザイン性にも優れたディジタルカメラを提供することができる。

【0067】また、この構成により、ディジタルカメラを密閉遮光状態にして電源投入後に、自動欠陥検出するクリーニングモードにて欠陥検出を行って、治具なしに欠陥検出を行うことができ、ディジタルカメラ10は、経年変化に対して欠陥検出を治具なしに対応することができる。したがって、検出した欠陥の位置に対して欠陥補正を施すことにより画素欠陥にともなう画質劣化を発生させることなく、ユーザに写真を提供することができる。画素欠陥補正は、白キズおよび/または黒キズの検出位置に応動して行うことができる。

【0068】なお、ユーザがディジタルカメラを買い上げて、最初の電源投入時に遮光状態を確認させ、クリーニングモードから動作開始させるように動作設定が行われている場合、製造工程における画素欠陥検出工程を省くことができ、工程の短縮化に大いに貢献し、コスト低減に寄与することができる。

[0069]

【発明の効果】このように本発明のディジタルカメラに 50

16

よれば、第1の筐体に光学系および撮像手段を配設し、 第2の筐体に表示手段を配設し、回動機構により第1お よび第2の筐体を互いに連結し、第1および第2の筐体 の内部における電気的な配線を互いに接続する配線を確 保し、第1および第2の筐体の自在な相対的な回動を行 わせ、実質的に同一平面上にある位置で光学系の入射光 面と表示手段の表示面とを同方向に、そして、両者の対 向位置では密閉状態とすることにより、密閉状態で撮像 手段に対して遮光状態を形成し、この状態を撮像手段の 異常検出に用い、これ以外の第1と第2の筐体との回動 においてはユーザの所望の回動位置で停止させることに より、光学系の保護用に複雑なメカニカル機構を採用し なくても光学系を十分保護し、デザイン性も高く、所望 の回動位置から被写体を表示手段で確かめながら狙うと ともでき、機構の簡略化により、製造コストを抑えると とができる。

【0070】また、本発明の光電変換デバイスの欠陥検出方法は、遮光部材でデバイスを遮光状態にし、このデバイスに対して給電し、遮光状態で第1の所定時間の給電を継続させた後に、デバイスのそれぞれから電気信号を読み出して、読み出した信号レベルと上限閾値レベルとを比較して上限閾値レベル以上の信号レベルになるデバイスの位置を示す位置情報を記憶するから、出荷後であっても、所望のときにデバイスの、いわゆる白キズに対する欠陥位置の検出を行うことができ、欠陥位置の画素欠陥補正を行って画質劣化を生じない写真をユーザに提供することができる。

【0071】さらに、本発明の光電変換デバイスの欠陥検出方法は、デバイスに対して所定の光量以上の入射光を入射させ、この入射光の入射後、デバイスのそれぞれから電気信号を読み出し、読み出した信号レベルと下限関値レベル以下の信号レベルになるデバイスの位置を示す位置情報を記憶するから、出荷後であっても、所望のときにデバイスの、いわゆる黒キズに対する欠陥位置の検出を行うことができ、欠陥位置の画素欠陥補正を行って画質劣化を生じない写真をユーザに提供することができる。

【0072】最後に、本発明の光電変換デバイスの欠陥 検出方法は、上述した白キズと黒キズの欠陥検出を順次 40 行うことにより、両方の画素欠陥に対する検出を行うこ とができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のディジタルカメラを斜め上方から見た 概略的な構成を示す斜視図である。

【図2】図1の回動筺体に配設されたモード切換スイッチと各種のモードを示すディジタルカメラの要部側面図である。

【図3】図1の回動筐体と2つの筐体との接続関係が明確化されるように回動筐体の要部を破断した斜視図であ

【図4】図1のディジタルカメラを180°回動させて開 いた状態を示す斜視図である。

17

【図5】図1のディジタルカメラの外筐同士を接触させ るまで回動させた状態を示す斜視図である。

【図6】図1のディジタルカメラにおける筐体内面の角 度が鈍角をなすように開いた状態の斜視図である。

【図7】図1のディジタルカメラの外筐が鈍角をなすよ うに開いた状態の斜視図である。

【図8】本発明のディジタルカメラにおける概略的なブ ロック構成を示す図である。

【図9】本発明のデバイスの自動欠陥検出方法を適用し た白キズおよび黒キズの欠陥検出手順を示すフローチャ ートである。

16:回動筐体

15a

20:モード切換スイッチ

\*【符号の説明】

10 ディジタルカメラ

20 モード切換スイッチ

30 操作部

34 システム制御部

200 光学系

202 フラッシュ

204 モニタ

206 項目選択操作部

10 340 画素欠陥検出機能部

342 欠陥アドレス指示機能部

344 欠陥補正機能部

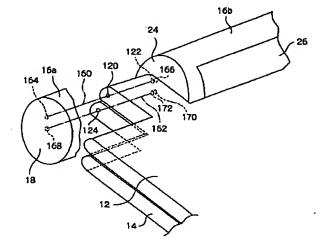
[図1]

10

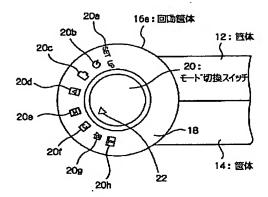
[図3]

14: 筐体

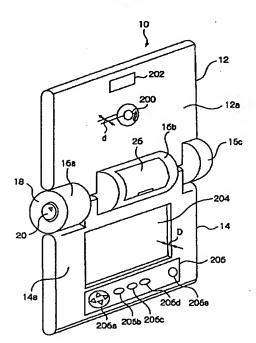
12: 笕体

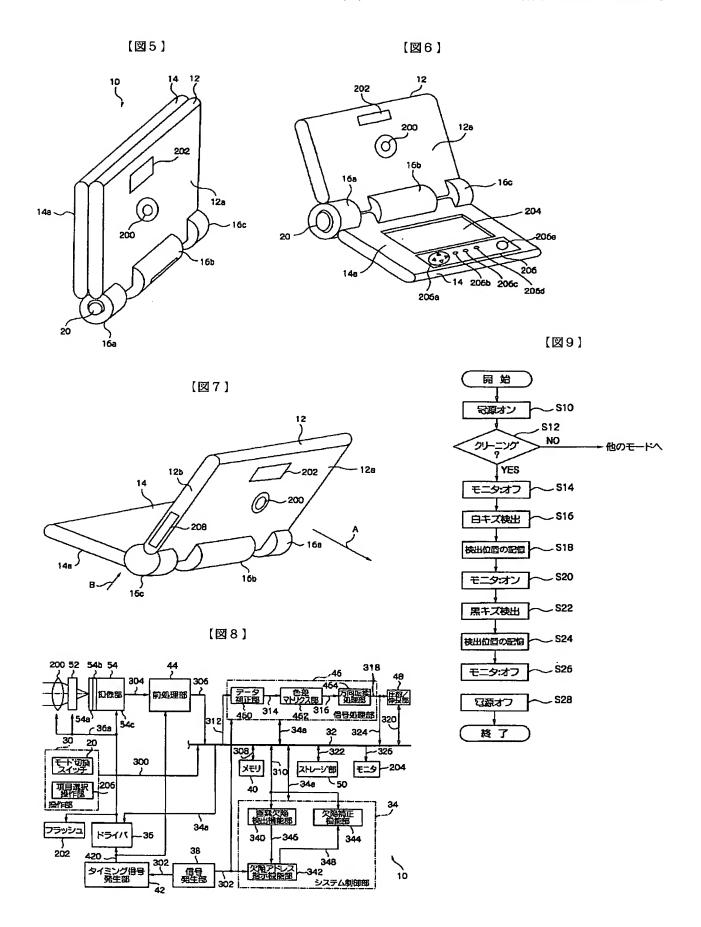


[図2]



[図4]





フロントページの続き

// H 0 4 N 101:00

(51)Int.C7.7

識別記号

F I H O 4 N 101:00 テーマコード(参考)

Fターム(参考) 2H054 AA01

5C022 AA13 AB00 AC42 AC69 AC77 5C024 BX01 CX23 CX27 DX04 GY01

GY31 HX14